

- **Microscopía electrónica de barrido (SEM)**

El microscopio electrónico de barrido (SEM) Phenom ProX es el más novedoso sistema de análisis de imagen y de rayos X. Phenom ProX permite examinar la morfología y estructura de las muestras, así como determinar su composición elemental. El software de identificación de elementos (EID) permite al usuario programar el análisis de puntos múltiples e identificar cualquier elemento oculto dentro de la muestra. Asimismo, el sistema Phenom ProX cuenta con diversos softwares que permiten la reconstrucción de la rugosidad en 3D así como la medida del tamaño de fibras, partículas y poros de una muestra.

